

1. 概要

ASTRO-Hの構造的な特徴は、全長12m質量2.4t(計画)という大型性と、高い指向精度要求にある。特に、その大きさに比して非常に高い指向精度要 求を軌道上で確実に満たすため、ASTRO-Hの構造検証計画の中には一般的な正弦波振動、音響、衝撃試験に加えて、熱変形と微小擾乱の検証試験が含 まれており、現在それら検証試験のうち熱変形試験のSTEP2までが終了している。熱変形試験の中では、熱的に過渡状態での計測、連続計測による温度変化 と変位との相関性の検証、新規開発の変位計測装置の導入などもあって極めて精度が高いと考えられる測定結果を得た。MTM試験や微小擾乱試験については、 本年春以降の実施に向け資材などの準備を進めている。

2. ASTRO-H 衛星構造概要

ASTRO-Hの軌道上での概形を図1に、ASTRO-Hの主要なサブシ ステムの位置と概要を表1に、衛星の構造概略と各サブの取り付け位 置を図2に示す。中央に長焦点距離の望遠鏡を搭載するため、バスの 1次構造が中央部を避けたパネル様式となっているのが特徴である。



3. 観測機器の指向精度要求

ASTRO-H構造として達成すべき目標となる各機器の指向精度 要求は表2の通りである。軌道上で各機器がこの精度を達成する よう、アライメント、熱変形、微小擾乱などの各誤差要因に対して 指向変動の許容値を機器ごとに割り当て、それを満たすかという 観点で、解析及び試験を実施している。

表1 主要機器、サブシステムの概要 略称 нхт 硬X線望遠鏡 SXT 軟X線望遠鏡 STT スター 精密軟X線分光装置。極低温まで冷やすための SXS 冷凍機とデュワー(SXS DWR)を持つ。 軟X線カメラ____ SXI HXIプレートのアライメントモニタ。レーザー光源 AMS (AMS-LD)とターゲットマーカー(AMS-T)により EOB伸展方向と直交する2軸の変位を検出。 SGD **軟γ線検出**器 HXI 硬X線撮像検出器 生産事 フィルターホール。SXSへの入射強度調整のた FWM めのフィルターと校正用の機器を含む。 固定式の光学ペンチ。トッププレート(TP)、ミドル プレート(MP)、ロワープレート(LP)の三段をCFRP FOB 柱及びアルミフィッティングで接続。望遠鏡と検出 社及びアルミノイッティングで接続。重速競ど使作 器の相対位置、相対姿勢を維持する。 軌道上で伸展する約6mの光学ベンチ。焦点距 離の長いHXT(12m)に対応し、HXT-HXIの間に求 められる相対位置、相対姿勢を維持する。 FOB 大半の電子機器、軟γ線検出器が取り付く衛星 側面の8枚のパネル。 ベースプレート(BP)、アウトリガー、スラスト 側面パネル 下部構体 チューブ、ロケット結合リングからなる構造体

4. 熱変形試験

2012年の4月~6月にかけて筑波の総合環境 試験棟で熱変形試験をSTEP2まで実施した。

試験全体のコンセプト

軌道上の温度差をそのまま地上の大気中で再現 することは出来ない。そこで構造要素ごとに加温し て変形量を計測し、同様の温度分布を与えた解 析値と比較することでモデルのコリレーションを実施 する。その後、コリレーションされたモデルで軌道上 変形量を予測し設計の妥当性を見る。

実施状況

ロケット結合リングなど、拘束の仕方に寄って検証 不能な箇所がそれぞれあることや、計測機器の配 置の問題から、試験は3STEPに分けた。





STEP2

試験結果概要

sel

se3

se4

se5

e6-01

AB-02

e9-01

case8

昇温箇所

アウトリガ・ +Y

EOB保持構造

SXT-Iダミー

SXT-Sダミ・

STTダミ

se9-02 HXT(-X)ダミ

OBトッププレート+Y

2,

3.

試験セットアップ要旨

1, 衛星横倒し状態で実施

図3 STEP2試験風景

OBチューブ (+Y+Xの縦部材)

スパネル+Y、スラストチューブ+Y

熱的に過渡状態で計測。(熱の拡散防止)

計測機器 計測箇所

軸傾斜 各望遠鏡光軸

> TT指向方向 WR基準 新星基準キ:

『星墨牟平ユー OB取付面など

代表点变形

LL < 5µm LL < 2秒角

2秒角

<9秒角

SXT-I 中心軸傾斜)

SXT-S中心軸傾斜)

(HXT中心軸傾斜) <2秒角 <2秒角

FOB TP

4 // m

-変位計

LD)

LD

ッメラ

AC)

実績∆

约20℃

530°C

約20°C

約15°C

約15°C

約4°C

約8°C

¢9°C

-6-71

要因一覧とそれに対する検証計画は表3に示す。システムレベル ではMTM、熱変形、微小擾乱に関して設計検証のための試験を 実施する計画である。 表2 各観測機器の観測要求精度 望溒鏡光軸 中心軸

		制御精度	制御精度		
SXS(南	\$X線分光器)	<120 arcsec	<55 arcsec		
SXI(軟	X線撮像器)	<120 arcsec	<184 arcsec		
HXI(碩	ēX線撮像器)	<60 arcsec	< 52 arcsec		
SGD (款γ線検出器)	<200 arcsec	NA		
*光軸:望遠鏡の *中心軸:望遠鏡 各誤差要因ごとに	性能が理想的となる 意の評価点と観測板 こ試験で検証すべき 表3検証書	3望遠鏡のみで決 機器の評価点を結 援数値はこれよりお 計画	まる光学的な軸 んだ、各観測機 よそ一桁小さい	器の観測軸 値となる。	
	誤差要因		システム	検証	



◎:解析と試験の両方を実施し、検証する項目 解析のみで評価する項目

ALL < 5µm ALL < 2秒角

-3秒角

<2秒角



列ナータ取得、新計測機器の導
入により、高精度かつ有用な計測
結果が得られている。

今後、さらなる詳細コリレーションを 実施し、現在一致していないケー スの原因を検討する予定。

約10℃ *計測結果は必ずしも衛星座標系に変換されていない。特にH,VはACのローカル座標系における傾斜方向を表す。 *オレンジ色の結果が試験と解析が一致しておらず、検討を要すると考えているケース